クロロフェノール類の電子付着による分解効率

中川清子*1)

Degradation Efficiency of Chlorinated Phenols caused by Electron Attachment

Seiko NAKAGAWA

Abstract The temperature dependence of the formation of negative ions was measured to investigate the degradation efficiency of chlorinated phenols caused by the electron attachment process. For all compounds, Cl⁻ was produced and the intensity of Cl⁻ increased with the increasing number of Cl atoms present in the molecule. For some chlorinated phenols, (M-HCl)⁻, (M-H)⁻, and M⁻ (M=parent molecule) were also observed. The intensities of the fragment ions such as Cl⁻ and (M-HCl)⁻, increased as the temperature increased, though that of the parent anion decreased. The result has shown that degradation of chlorinated phenols by electron attachment will occur efficiently at higher temperature.

Keywords Chlorinated Phenol, Electron Attachment, Degradation, Negative Ion, Fragmentation

1.はじめに

クロロフェノール類は、主として絶縁体や化学工業の副生 成物として、広く使用されてきた。しかし、環境ホルモンの 疑惑がとりざたされ、焼却炉中でのダイオキシン生成の前駆 物質であると考えられるようになってきた。これらの観点か ら、クロロフェノールの分解処理方法の開発が望まれている。

クロロフェノールの分解方法については、溶媒の種類やpH を制御したり、触媒やラジカル捕獲剤を使用するなどの手法 を用いたいくつかの研究報告があるが^{1.5})、効果的な手段の 開発には至っていない。クロロフェノールの分解機構を複雑 にしているのは、少なくても二つの理由が考えられる。一つ は、水系においてpHによっては、水酸基のHが解離して しまうこと、もう一つは、クロロフェノールが少なくても三 種類の活性種(H,OH,電子)と反応しやすいことである。こ れらの反応の中でも、解離型電子付着反応は、重要な反応の 一つである。また、クロロフェノール類の脱塩素効率は、塩 素の置換位置に依存することがわかっている⁵⁾。そこで、ク ロロフェノールの電子付着により生成するアニオンの性質 を検討することは、効果的な脱塩素反応の開発に不可欠であ る。

ハロゲン置換したベンゼン誘導体の電子付着に関する報告は少ない。最近、Denzerのグループでは、塩化ジベンゾフランおよび塩化ジベンゾダイオキシンについて負イオン化学イオン化(NCI)および電子吸収スペクトル法(EAS)

により生成するアニオンを研究している。彼らは、生成する CIイオン強度は、分子内の塩素原子の数が増加するに伴っ て増加することを報告している^{6,7)}。また、Muftakhov らは、 4-クロロフェノールの EAS を測定し、CIと(M-H) (親分子 Mから Hがとれたアニオン)が生成すること報告している⁸⁾。 しかし、他のクロロフェノール類についての研究は行われて いない。著者は、負イオン化学イオン化質量分析法(NCIMS) を用いて、クロロフェノール類から生成するアニオンを初め て測定し、脱塩素効率について検討した。

- 2. 実験方法
- 2.1 負イオン化学イオン化質量分析法
- 2.1.1 イオン化の原理

ガスクロマトグラフ・質量分析計(GC/MS)のイオン化 室で起こる反応を図1に示す。

フィラメントから放出された電子は、反応ガス(P)と衝突 し、脱活性(式 1a)および反応ガスのイオン化(式 1b)を経て、 熱化(e⁻(thermal))する。熱化した電子が、試料成分の気体分 子(M)に付着してアニオンが生成(式 2)する。

$e^{-} + P$ e^{-} (thermal) + P*	(1a)
------------------------------------	------

e ⁻ + P	e ⁻ (thermal) -	+ e ⁻ (thermal) +	- P ⁺	(1b)
--------------------	----------------------------	------------------------------	------------------	------

 e^{-} (thermal) + M Anions (2)

図1 負イオン化学イオン化の原理

*1)放射線応用技術グループ







図3 イオン源の概念図

2.1.2 装置

装置およびイオン化室の概略を図2及び3に示す。ガスク ロマトグラフのカラムで分離された試料分子は、インターフ ェイスを通して、イオン化室に導入される。図1の原理にし たがって生成したアニオンは、四重極マスフィルターで質量 分離され、電子増倍管で検出される。また、生成したイオン 総量の時間変化(全イオンクロマト:TIC)は、全イオンモ ニターで観測される。これは、いわゆるGCのクロマトグラ フに対応する。

反応ガスとしては、イソブタンを用いた。イソブタンの流 量は、質量分析管の圧力をモニターして、最適化している。 圧力は、イソブタン導入時には 2.5~3.0×10⁻⁵Torr、未導入 時には 1.0~2.0×10⁻⁶Torr である。また、電子の濃度は、リ ペラで検出し、フィラメント電流を制御している。イオン化 室の温度は、白金センサーで測定し、コンピュータで温度制 御した。測定温度は、423K, 473K, 523K, 573K とした。 2.2 試料



図4 クロロフェノールの構造

2-クロロフェノール(o-CIP),3-クロロフェノール(m-CIP), 3,4-,3,5-,2,3-,2,4-,2,5-,2,6- ジクロロフェノール(DCP), 2,3,4-,2,4,6-,2,3,6-,2,3,5-,2,4,5-トリクロロフェノール(TCP)の 13種類のクロロフェノールを実験に使用した。クロロフェ ノールの塩素原子の置換位置は、図4の数字で現すものとす る。

各試料は、イソプロピルアルコールに溶かし、0.4~1.4µ1 をガスクロマトグラフの注入口から導入した。試料は、カラ ムで溶媒や不純物と分離され、単一のピークとして観測され た。また、クロロフェノール類は東京化成、イソプロピルア ルコールは和光純薬製で、購入したものをそのまま使用し た。

3.結果

イオン源温度 423K での 2,3,4-TCP で得られた TIC とピー クでの質量スペクトルを図 5 に示す。観測されたアニオンは、 Cl,(M-HCI)(親分子 M から HC1 がとれたアニオン)及び M(親分子アニオン)である。塩素原子には 2 種類の同位体



(³⁵Cl,³⁷Cl)が存在する。その存在比は3:1であり、図5 のClの比とよく一致している。(M-HCl)および M は、それ ぞれ2個および3個の塩素原子が存在し、その同位体比は、



9:6:1および27:27:9:1と求められる。図5での(M-HCI)および M の比は、一番存在比の小さいアニオン についてはイオン強度が小さすぎて認められないものの、期 待される存在比をよく再現している。

イオン強度はすべての同位体の和を積分して求め、試料注 入量に対してプロットした(図6)。すべてのイオン強度は 注入量に比例し、その傾きから各イオンの試料 10⁻⁷ モルあた りのイオン強度を求めた。

すべてのクロロフェノールで、主に生成するアニオンは、 Clであり、そのイオン強度は分子内の塩素原子の数が増加 するに伴って増加した。この結果は、Deinzer らの塩化ジベ ンゾフランおよび塩化ジベンゾダイオキシンの結果^{6,7)}と一 致する。Cl⁻イオン強度は、2,3,4- < 2,4,5- < 2,3,5- < 2,3,6- ≈

表1 解離型アニオン強度比の傾きと 573K での (M-HCI)⁻アニオン強度比

	傾き	(M-HCI) ⁻ アニオン強度比
2,3,4-TCP	0.165±0.013	0.255
2,3,5-TCP	0.150 ± 0.007	0.354
2,3,6-TCP	0.205 ± 0.013	0.272
2,4,5-TCP	0.159 ± 0.004	0.650
2,4,6-TCP	0.177±0.017	0.230
2,6-DCP	0.180 ± 0.004	0.066
2,3-DCP	0.105 ± 0.003	0.240
2,5-DCP	0.215 ± 0.004	0.126
3,4-DCP	0.060 ± 0.001	0.280
3,5-DCP	0.060±0.001	0.654



2,4,6-TCP および 3,4-≈2,5-<2,4-<2,6<2,3-≈3,5-DCP の順 で強い。また、(M-HCI) アニオン強度は、2,3,4-<2,3,6-≈2,4,6-< 2,3,5-≈2,4,5-TCP および 2,4-<2,5-≈2,6-<3,4-<2,3-< 3,5-DCP の順で強い。DCP および TCP では、(M-H) も観測 されたが、そのイオン強度は CI の 1/20 以下であった。2,3,4-および 2,4,5-TCP では 523K 以下で、その他の TCP では 473K 以下で、親分子アニオンが観測された。DCP およびモノク ロロフェノール類では、親分子アニオンは観測されなかった。

TCP および DCP において、CI と(M-HCI) アニオンのイオ ン強度比の温度依存を図7 - 8 に示す。また、図から得られ た傾きと 573K での(M-HCI) アニオン強度比を表1 にまとめ た。3,4-,3,5-DCP 以外では、プロットの傾きはほぼ同じであ り、クロロフェノールの塩素原子の置換位置による影響はほ とんどなかった。これは、(M-HCI) アニオン生成機構が3,4-, 3,5-DCP 以外では、同じためと考えられる。一方、423K で の(M-HCI) アニオン強度比は、2,4,6- < 2,3,4- < 2,3,6- < 2,3,5-< 2,4,5-TCP、2,6- < 2,5- < 2,3- < 3,4- < 3,5-DCP の順に増加し、 塩素原子の置換位置が(M-HCI) アニオン生成のしやすさに 関係しているものと推測される⁹。

2,3,4-および 2,4,5-TCP での親分子アニオンと解離型アニ オン(Cl, (M-HCl))の強度比の温度依存を図9に示す。温度の 低下に伴って、親分子アニオンの強度比が増加しているのが わかる。生成したアニオンから、クロロフェノールの電子付 着の反応機構は、図10のように考えられる。

解離型アニオンのイオン強度は温度の増加に伴って増加す るが、親分子アニオンのイオン強度は減少する。後者の減少 割合は、前者の増加割合より大きく、高温では、親分子アニ オンの解離による CI及び(M-HCI)の生成(k₂, k₃)のみならず、 電子脱離(k₁)も起きていると考えられる。図6の結果から、 室温付近での親アニオンの強度比を外挿で求めると、20 以 上の値が得られ、電子付着で生成した親アニオンが安定に存 在することが推測される。クロロフェノール類の解離型電子 付着による分解処理が室温で効率よく起こらないのは、この ためと考えられる。

4.まとめ

イオン源温度 423~573K で、クロロフェノール類の電子 付着により生成するアニオンのイオン強度を負イオン化学 イオン化質量分析法を用いて測定した。温度の上昇に伴って、 解離型アニオンのイオン強度は増加し、親分子アニオンのイ オン強度は減少した。室温付近での解離型アニオンに対する 親分子アニオンのイオン強度比は 20 倍程度であり、安定に 存在できることがわかった。

この事から、電子付着による脱塩素反応を利用してクロロ フェノール類を分解処理するためには、高温での処理が必要 であることがわかった。気相もしくは超臨界状態での 473K 以上での処理システムが有効と考えられる。

参考文献

- 1) N. Serpone, I. Texier, A. V. Emeline, P. Pichat, H. Hidaka, and J. Zao, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 136, 145 (2000).
- N. Getoff and S. Solar, Radiat. Phys. Chem., 28, 443 (1986).
- N. Getoff and S. Solar, Int. J. Radiat. Appl. Instrum. Part C, 31, 121 (1988).
- F. Taghipour and G. J. Evans, Radiat. Phys. Chem., 49, 257 (1997).
- 5) S. Nakagawa and T. Shimokawa, Radiat. Phys. Chem., 63,

151 (2002).

- Y-S. Chang, J. A. Laramee, and M. L. Deinzer, Anal. Chem., 63, 2716 (1991).
- V. D. Berkout, P. Mazurkiewicz, and M. L. Deinzer, J. Am. Chem. Soc., 121, 2561 (1999).
- 8) M. V. Muftakhov, R. V. Khatymov, and V. A. Mazunov, Rapid Comm. in Mass Spectro., 14, 1468 (2000).
- 9) S. Nakagawa, Int. J. Mass Spectrom., 232, 265 (2004).

(原稿受付 平成16年8月4日)